

19 装置功能试验

方法	62	附录 A (资料性附录) 用热电偶测量温度的推荐型式试验导则
	63	附录 B (资料性附录) 基于 IEC 61058 的数字化接口试验
	65	附录 C (资料性附录) 固有误差、运行误差和系统误差
	66	附录 D (资料性附录) 基于 IEC 61058 的数字化接口试验

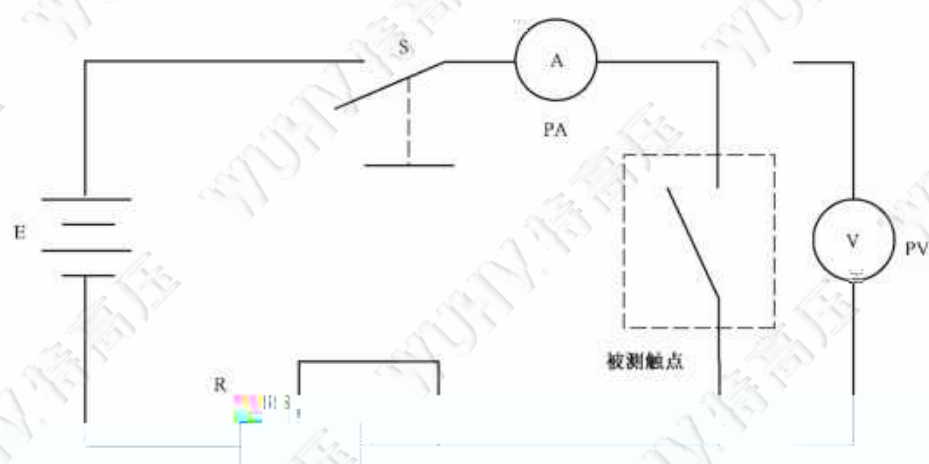
6 基本性能试验

6.1 触点基本参数试验

6.1.1 触点接触同步测试

6.1.1.1 测试方法：

a) 触点接触



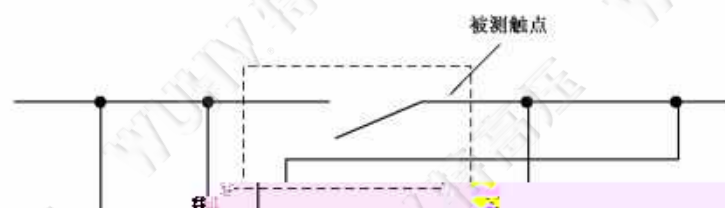
- E 直流电压源
 S 测试开关
 A 电流表
 V 电压表
 R 标准电阻

图2 采用伏安法测触点接触电阻的测试电路示例

图3为用电压表法测试触点接触电阻的测试电路示例。

被测触点







b) 测试方法的选用按产品标准规定；

c) 用伏-安法测量线圈电阻时，电压表应采用高内阻表。

对变化测试电路如图 7 所示，电阻变化测试电路如图 8 所示。

b) 对电压变换器初级绕组施加电压 U_1 为额定电压, 测量次级绕组电压 U_2 ;

对电压变换器初级绕组施加电压 U_1 为额定电压, 测量次级绕组电压 U_2 ;

c) 计算变比

电压变换器变比用式(3)计算:



图1 电源设备输入侧的测试电路
 (a) 测试电路接入不同测试电压值
 (b) 测试不同电压值下负载消耗的功率
 (c) 测试不同电压值下负载消耗的功率

6.3.4 功率因数、空载损耗测试

(a) 测试电路如图1所示。

(b) 输入三相电压的测试电压值如图1所示。

(c) 输入三相电压的测试电压值如图1所示。

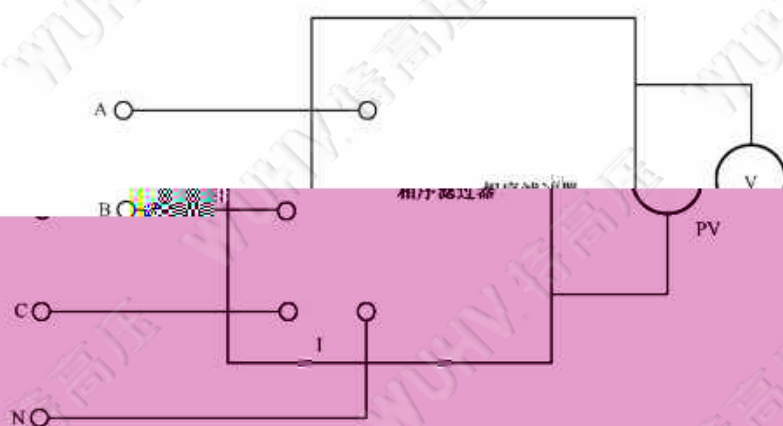


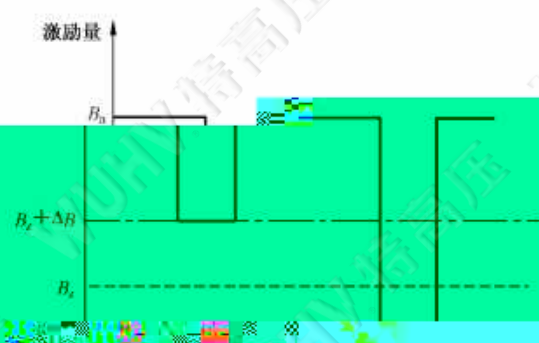
图 11 相序过滤器输出电压测试电路示例

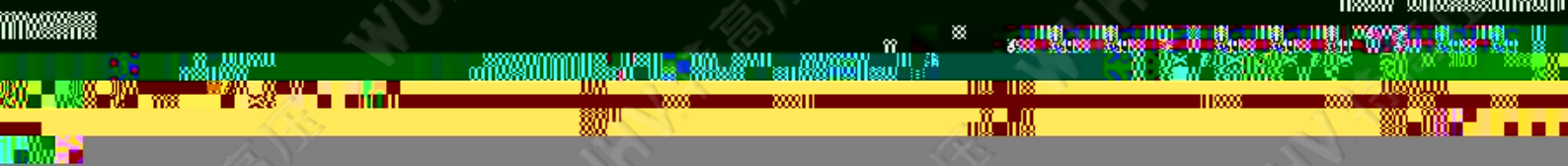
6.4 有或无继电器功能试验

6.4.1 有或无继电器试验程序

有或无继电器的功能试验参照 GB/T 1983—2008。试验程序如图 12 所示。图中上面的波形表

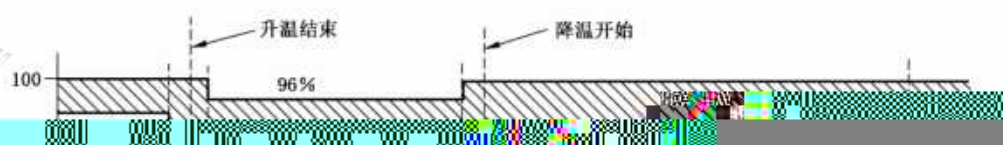
示激励值，下表示继电器状态，1 表示动作状态，0 表示不动作状态。试验时继电器施加激励

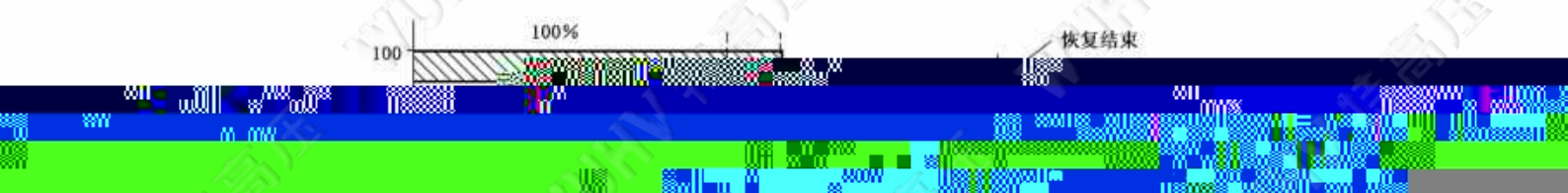






高温、低温下各保持 3 h。2.2.2 变升高或降低的变化速率 5℃/h。





12.3 地震试验

12.3.1 总则

地震试验按 IEC 60255-21-3:1993 规定的方法进行。

地震试验有两种试验方法：

方法 A：单轴正弦扫频地震试验；

方法 B：双轴多频随机地震试验。

12.3.2 单轴正弦扫频地震试验（方法 A）

12.3.2.1 试验要求

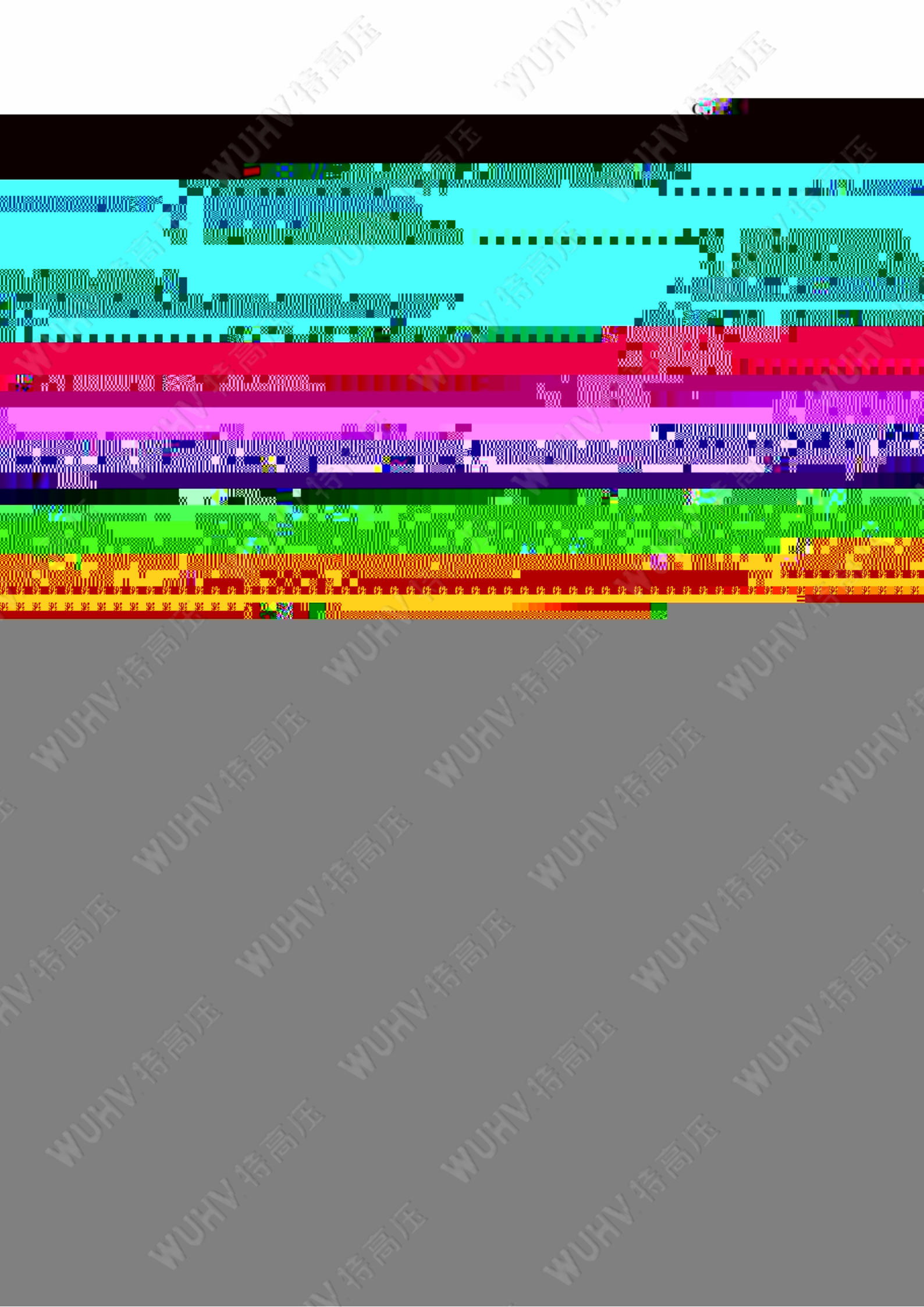
单轴正弦扫频地震试验

改变他的正常状态,则认为他们已不动作或不返回。

12.3.6.2 试验期间,被试设备的信号牌或其他形式的机械信号指示可能会永久性地改变其工作状态。

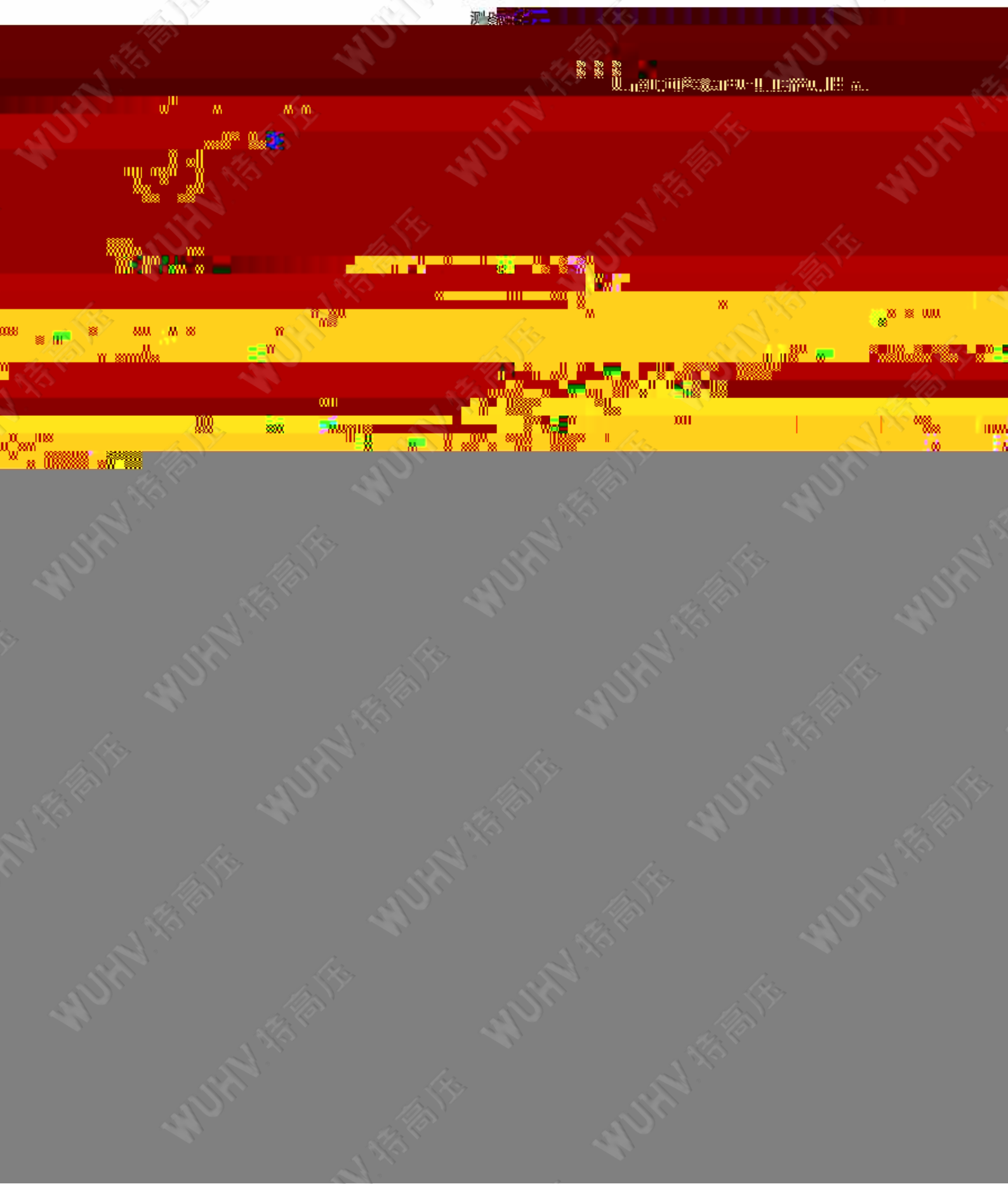
12.3.6.3 试验结束后,被试设备应仍满足相应的性能要求,定值

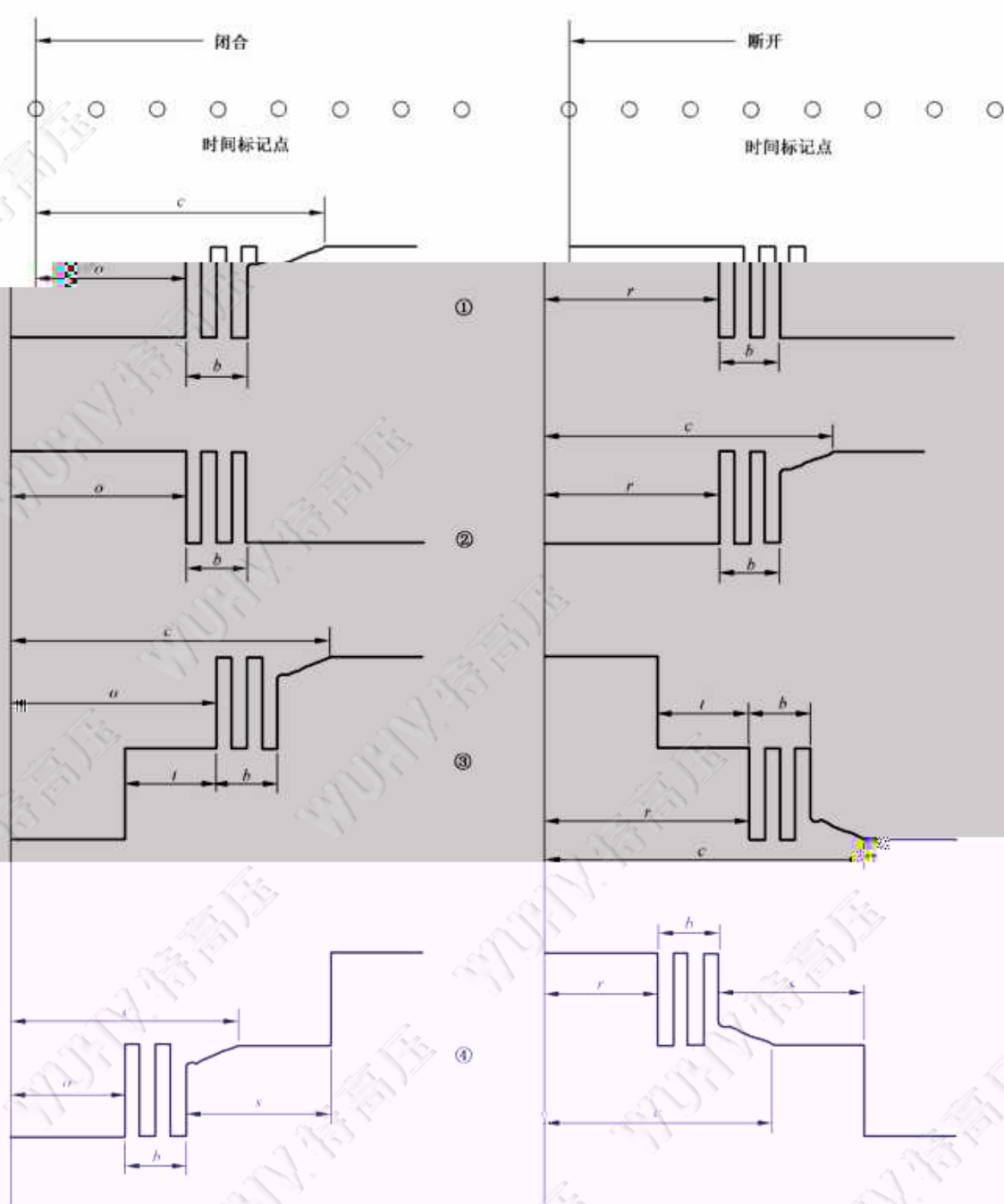
水平燃烧试验级别分为 H₁、H₂、H₃、H₄、H₅、H₆、H₇、H₈、H₉、H₁₀、H₁₁、H₁₂、H₁₃、H₁₄、H₁₅、H₁₆、H₁₇、H₁₈、H₁₉、H₂₀、H₂₁、H₂₂、H₂₃、H₂₄、H₂₅、H₂₆、H₂₇、H₂₈、H₂₉、H₃₀、H₃₁、H₃₂、H₃₃、H₃₄、H₃₅、H₃₆、H₃₇、H₃₈、H₃₉、H₄₀、H₄₁、H₄₂、H₄₃、H₄₄、H₄₅、H₄₆、H₄₇、H₄₈、H₄₉、H₅₀、H₅₁、H₅₂、H₅₃、H₅₄、H₅₅、H₅₆、H₅₇、H₅₈、H₅₉、H₆₀、H₆₁、H₆₂、H₆₃、H₆₄、H₆₅、H₆₆、H₆₇、H₆₈、H₆₉、H₇₀、H₇₁、H₇₂、H₇₃、H₇₄、H₇₅、H₇₆、H₇₇、H₇₈、H₇₉、H₈₀、H₈₁、H₈₂、H₈₃、H₈₄、H₈₅、H₈₆、H₈₇、H₈₈、H₈₉、H₉₀、H₉₁、H₉₂、H₉₃、H₉₄、H₉₅、H₉₆、H₉₇、H₉₈、H₉₉、H₁₀₀、H₁₀₁、H₁₀₂、H₁₀₃、H₁₀₄、H₁₀₅、H₁₀₆、H₁₀₇、H₁₀₈、H₁₀₉、H₁₁₀、H₁₁₁、H₁₁₂、H₁₁₃、H₁₁₄、H₁₁₅、H₁₁₆、H₁₁₇、H₁₁₈、H₁₁₉、H₁₂₀、H₁₂₁、H₁₂₂、H₁₂₃、H₁₂₄、H₁₂₅、H₁₂₆、H₁₂₇、H₁₂₈、H₁₂₉、H₁₃₀、H₁₃₁、H₁₃₂、H₁₃₃、H₁₃₄、H₁₃₅、H₁₃₆、H₁₃₇、H₁₃₈、H₁₃₉、H₁₄₀、H₁₄₁、H₁₄₂、H₁₄₃、H₁₄₄、H₁₄₅、H₁₄₆、H₁₄₇、H₁₄₈、H₁₄₉、H₁₅₀、H₁₅₁、H₁₅₂、H₁₅₃、H₁₅₄、H₁₅₅、H₁₅₆、H₁₅₇、H₁₅₈、H₁₅₉、H₁₆₀、H₁₆₁、H₁₆₂、H₁₆₃、H₁₆₄、H₁₆₅、H₁₆₆、H₁₆₇、H₁₆₈、H₁₆₉、H₁₇₀、H₁₇₁、H₁₇₂、H₁₇₃、H₁₇₄、H₁₇₅、H₁₇₆、H₁₇₇、H₁₇₈、H₁₇₉、H₁₈₀、H₁₈₁、H₁₈₂、H₁₈₃、H₁₈₄、H₁₈₅、H₁₈₆、H₁₈₇、H₁₈₈、H₁₈₉、H₁₉₀、H₁₉₁、H₁₉₂、H₁₉₃、H₁₉₄、H₁₉₅、H₁₉₆、H₁₉₇、H₁₉₈、H₁₉₉、H₂₀₀、H₂₀₁、H₂₀₂、H₂₀₃、H₂₀₄、H₂₀₅、H₂₀₆、H₂₀₇、H₂₀₈、H₂₀₉、H₂₁₀、H₂₁₁、H₂₁₂、H₂₁₃、H₂₁₄、H₂₁₅、H₂₁₆、H₂₁₇、H₂₁₈、H₂₁₉、H₂₂₀、H₂₂₁、H₂₂₂、H₂₂₃、H₂₂₄、H₂₂₅、H₂₂₆、H₂₂₇、H₂₂₈、H₂₂₉、H₂₃₀、H₂₃₁、H₂₃₂、H₂₃₃、H₂₃₄、H₂₃₅、H₂₃₆、H₂₃₇、H₂₃₈、H₂₃₉、H₂₄₀、H₂₄₁、H₂₄₂、H₂₄₃、H₂₄₄、H₂₄₅、H₂₄₆、H₂₄₇、H₂₄₈、H₂₄₉、H₂₅₀、H₂₅₁、H₂₅₂、H₂₅₃、H₂₅₄、H₂₅₅、H₂₅₆、H₂₅₇、H₂₅₈、H₂₅₉、H₂₆₀、H₂₆₁、H₂₆₂、H₂₆₃、H₂₆₄、H₂₆₅、H₂₆₆、H₂₆₇、H₂₆₈、H₂₆₉、H₂₇₀、H₂₇₁、H₂₇₂、H₂₇₃、H₂₇₄、H₂₇₅、H₂₇₆、H₂₇₇、H₂₇₈、H₂₇₉、H₂₈₀、H₂₈₁、H₂₈₂、H₂₈₃、H₂₈₄、H₂₈₅、H₂₈₆、H₂₈₇、H₂₈₈、H₂₈₉、H₂₉₀、H₂₉₁、H₂₉₂、H₂₉₃、H₂₉₄、H₂₉₅、H₂₉₆、H₂₉₇、H₂₉₈、H₂₉₉、H₃₀₀、H₃₀₁、H₃₀₂、H₃₀₃、H₃₀₄、H₃₀₅、H₃₀₆、H₃₀₇、H₃₀₈、H₃₀₉、H₃₁₀、H₃₁₁、H₃₁₂、H₃₁₃、H₃₁₄、H₃₁₅、H₃₁₆、H₃₁₇、H₃₁₈、H₃₁₉、H₃₂₀、H₃₂₁、H₃₂₂、H₃₂₃、H₃₂₄、H₃₂₅、H₃₂₆、H₃₂₇、H₃₂₈、H₃₂₉、H₃₃₀、H₃₃₁、H₃₃₂、H₃₃₃、H₃₃₄、H₃₃₅、H₃₃₆、H₃₃₇、H₃₃₈、H₃₃₉、H₃₄₀、H₃₄₁、H₃₄₂、H₃₄₃、H₃₄₄、H₃₄₅、H₃₄₆、H₃₄₇、H₃₄₈、H₃₄₉、H₃₅₀、H₃₅₁、H₃₅₂、H₃₅₃、H₃₅₄、H₃₅₅、H₃₅₆、H₃₅₇、H₃₅₈、H₃₅₉、H₃₆₀、H₃₆₁、H₃₆₂、H₃₆₃、H₃₆₄、H₃₆₅、H₃₆₆、H₃₆₇、H₃₆₈、H₃₆₉、H₃₇₀、H₃₇₁、H₃₇₂、H₃₇₃、H₃₇₄、H₃₇₅、H₃₇₆、H₃₇₇、H₃₇₈、H₃₇₉、H₃₈₀、H₃₈₁、H₃₈



附录 A (资料性附录)

附录 A





说明:

①——动合触点;

②——动断触点;

r ——返回时间;

t ——回跳时间;

注：当被试元件的准确度低时，也宜考虑该元件的回差现象。

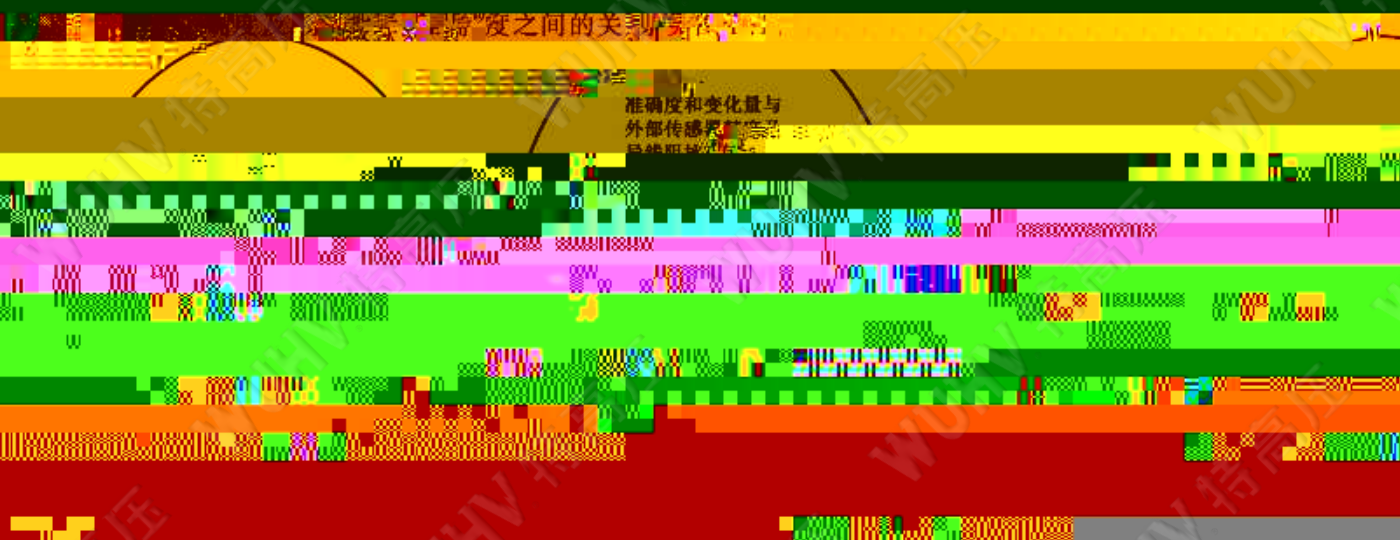
C.2.5 延时时间

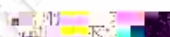
被试设备的延时时间应整定为实际应用中所规定范围的最小值。

附录 D

(资料性附录)

固有误差、运行误差和校准误差





(资料性附录)

地震试验选择原则

已经存在很多试验方法,旨在验证设备能够承受各种应力而不误动作。这些方法从简单的连续正弦波到复杂的、专业的时间历程方法。每一种方法都特别适用于特定的要求、环境,或者代表

— 44 —